

電子情報通信工学専攻

平成 28 年度

科 目 名	集積回路工学 Integrated Electronics			担当教員	長岡史郎				
学 年	2年	学 期	前期	履修条件	選択	単位数			
分 野	専門	授業形式	講義	科目番号	16273021	単位区分			
学習目標	半導体デバイスをブラックボックスとして扱うのではなく、半導体の基本的性質を理解した上でデバイスの素子特性や動作を理解する。半導体集積回路を構成するデバイスの構造や製造方法の概要を理解し、デバイス設計技術や集積回路製作の要素技術に関する知識を習得することを目標とする。								
進 め 方	教科書に沿って進める。講義内容の理解を助けるため、毎回基本的な課題を宿題としてできるだけ出題する。与えられた課題について資料検索し、その要約を作成とともに自分の意見をまとめて発表し、レポートとして提出する。半導体技術の歴史を学ぶとともに将来の技術について考える。								
学習内容	学習項目 (時間数)			学習到達目標					
	1. 集積回路の歴史(2) 2. 集積化技術(2) (1) バイオニア集積回路(バイオニア IC) (2) MOS 集積回路 (MOS IC) 3. 集積化の利点(2) (1) 小型化、軽量化と経済性 (2) 動作速度信頼性 4. 集積回路製作技術(7) (1) シリコンウェーハとエピタキシャルウェーハ (2) 酸化 (3) 絶縁膜と多結晶シリコン堆積 (4) ドープ・拡散と注入打ち込み (5) パターン描画と転写およびエッチング 5. 集積回路要素技術のまとめと発表(4) 6. 集積回路(IC)の構成要素とその特性(4) (1) ダイオードとトランジスタ (2) 抵抗器とキャパシタ 7. デジタル論理 IC の基本的な構造と特性(5) (1) バイオニアデジタル論理集積回路 (2) MOS デジタル論理集積回路 (3) CMOS, BiCMOS 論理集積回路 8. デジタルIC の基本的な構造と特性(4) (1) MOS デジタル集積回路 (2) ステイック型集積回路 (3) 讀み出し専用型と不揮発性メモリデバイス			集積回路とはなにか、またシリコン集積回路の原理的な製作プロセスを説明できる。 なぜ大規模集積化への努力がなされるのか説明できる。 MOS トランジスタを用いた集積回路のプロセスフローを説明できる。 与えられた課題について資料収集し報告書にまとめることができる。 集積回路内に作製された能動、受動素子について構造や特性を明できる。 PN 接合やバイオニアトランジスタ及び MOS トランジスタの諸特性についての簡単な計算ができる。 C-MOS トランジスタの動作を説明できる。また省電力のメカニズムを説明できる。 デジタルIC やセンサデバイスの構成、構造を説明できる。					
評価方法	前期末試験								
	9. 試験問題の解答(1)								
履修要件	定期試験 70%, レポート 10%, 授業での質疑応答 10%、ノート 10%の比率で総合評価する。中間試験を実施する場合もある。割合は変更する場合もある。								
関連科目	半導体工学 I (4 年) → 半導体工学 II (5 年) → 応用電子物性工学(専 1 年) → 集積回路工学(専 2 年)								
教 材	教科書：荒井英輔編著「集積回路 A」 オーム社 参考書：管野卓雄著「半導体集積回路」コロナ社 教 材：自作プリント								
備 考	オフィスアワー：毎月曜日放課後～17:00								